

TOF-SIMS による界面活性剤残渣の分析

電子部品の製造には数多くの洗浄工程がありますが、しばしば界面活性剤残渣により汚染問題が発生します。これらは TOF-SIMS によるイオンイメージ分析が有効です。

試料の光学顕微鏡観察



試料の光学顕微鏡像

Si 半導体のウェハプロセスにて観察された異物の元素分析と同時に、その由来を確認するため、TOF-SIMS によるイメージ分析を行う。

左図中の赤枠は分析領域を示す。

TOF-SIMS は無機物・有機物を ppm オーダーの感度で検出できるので、多くの情報を得ることができる。

TOF-SIMSによるイオンイメージ分析

